

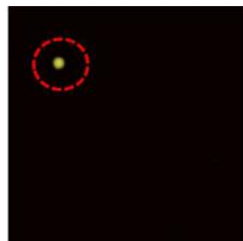
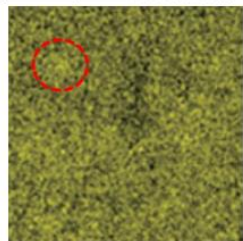
蛍光X線分析装置

メーカー	株式会社 堀場製作所
型式	XGT-9000
装置概要	試料にX線を照射する際に発生した特性X線を検出、解析した結果として、試料を構成する元素および組成情報が得られます。試料の組成比（wt.%）を標準試料を用いない半定量法により算出します。
性能・特徴	試料サイズ：200×200×60mmまで設置可能 分解能：100 μ m 検出器：シリコンドリフト検出器 ・試料表面のNa～Uまでの範囲の元素（RoHS規制対象物質のCrやPbを含む）を検出できます。 ・また、固体・液体・粉体の試料に対応可能です。光学CCDによる計測部分のイメージ画像に計測結果を重ね合わせた画像にして、マッピング表示ができます。

①ピーク分離による異物・不良解析

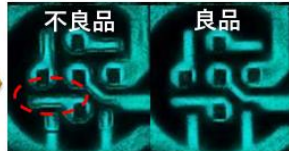
粒子強調表示

フィルム中の埋没異物解析

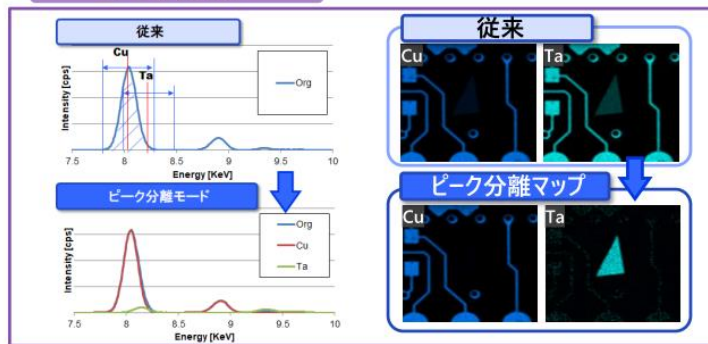


複数画像掛け合わせ

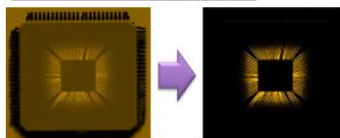
LEDパターンの不良解析



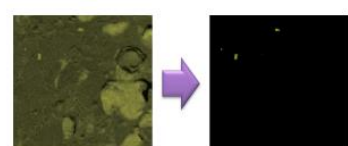
ピーク分離マップ



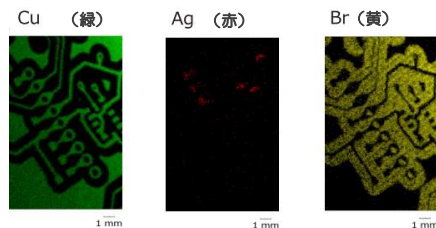
ICパッケージ内部の不良解析



食品中金属異物の解析



②マッピングによる基板上でのブリッジの検出



重ね合わせ



測定時間は13分



設置場所：地方独立行政法人青森県産業技術センター工業総合研究所 機器分析室

※本装置は、公益財団法人 JKAの補助を受けて導入しました。